

目 次

	ページ
1. 適用範囲	2
2. 引用規格	2
3. 一般事項	2
4. 定義	2
5. 分析項目	3
6. 定量範囲	3
7. 試料	3
7.1 試料の採取及び調製	3
7.2 試料の取り扱い方	3
8. 定量方法	4
8.1 原理	4
8.2 標準物質・標準化用粉末試料	4
8.3 装置及び器具	4
8.4 定量操作	4
9. 分析値の報告	8
10. 測定条件の設定と定量下限の算出	8
10.1 測定条件の設定	8
10.2 定量下限の算出方法	8
附属書	9
解説	12

日本セラミックス協会規格

JCRS 113—2019

ファインセラミックス用窒化けい素微粉末の蛍光 X 線分析方法

Methods for X-ray fluorescence spectrometric analysis of fine silicon nitride powders for fine ceramics

1. 適用範囲

この規格は、ブリケット法を用いた波長分散形蛍光 X 線分析によるファインセラミックス用窒化けい素微粉末中の化学組成分析方法について規定する。

2. 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

- JIS K 0050 化学分析方法通則
- JIS K 0119 蛍光 X 線分析方法通則
- JIS K 0211 分析化学用語（基礎部門）
- JIS K 0215 分析化学用語（分析機器部門）
- JIS R 3503 化学分析用ガラス器具
- JIS R 2216 耐火物製品の蛍光 X 線分析方法
- JIS Z 8401 数値の丸め方

3. 一般事項 分析方法の一般事項については、JIS K 0050 及び JIS K 0119 の規定による。

4. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は、JIS K 0119、JIS K 0211 及び JIS K 0215 によるほか、次による。

a) 粉末状試料 ブリケット作製に用いる粉末状の試料。標準物質、標準化用粉末試料、及び分析用粉末試料に分かれる。

- 1) 標準物質 検量線の作成、測定条件及び許容差の検定に用いる組成が既知の一連の試料。
- 2) 標準化用粉末試料 標準化用ブリケットの作製に用いる粉末試料。
- 3) 分析用粉末試料

b) ブリケット 蛍光 X 線分析に用いるために、粉末状試料から作製した平坦な表面をもつ円形の加圧成形物。検量線用ブリケット、標準化（ドリフト補正）用ブリケット、及び分析用ブリケットに分かれる。

- 1) 検量線用ブリケット 検量線の作成に用いるブリケット。
- 2) 標準化（ドリフト補正）用ブリケット 装置の所定の運転条件下で、経時的な蛍光 X 線強度（以下、